

Journées de la plateforme MIFHySTO

3 février 2022

Journée Métrologie Avancée

PROGRAMME

9h00-9h20

Accueil et présentation de la journée

9h20-9h50

Présentation du principe de la tomographie
RX solution

9h50-10h20

Traitement et analyse tomographique
Volume Graphics

10h20-10h40

Pause café

10h40-11h10

Retour d'expérience en tomographie
Jérôme Adrien, INSA Lyon

11h10-11h40

Présentation métrologie optique
Anne Calvez, Bruker Alicona

11h40-12h00

Visite des équipements

12h00-13h30

Repas

13h30-16h00

Ateliers pratiques

16h00

Fin de la journée

L'objectif de cette journée est de présenter les possibilités de la plateforme MIFHySTO en termes de métrologie par le biais de la micro-nano Tomographie et de la métrologie optique.

Cette journée s'articulera autour de ces deux techniques avec des conférences en matinée et des ateliers l'après-midi.

Trois partenaires industriels seront présents :

- Solutions en tomographie :
RX solutions
<https://www.rx-solutions.com/>
- Traitement d'images tomographiques :
Volume Graphics
<https://www.volumegraphics.com/fr/>
- Solutions métrologie optique :
Bruker Alicona
<https://www.alicon.com/>



ENSMM bâtiment transfert
26 Rue de l'Épitaphe, 25000 Besançon

Contact : xavier.gabrion@ens2m.fr



Bruker alicona

Inscription en ligne

<https://www.femto-st.fr/fr/L-institut/evenements/journee-metrologie-avancee>